(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-83465

(43)公開日 平成8年(1996)3月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

戲別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G11B 19/12

501 N 7525-5D

7/09 9368-5D

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-218541

平成6年(1994)9月13日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 筒井 敬一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 五十嵐 勝治

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

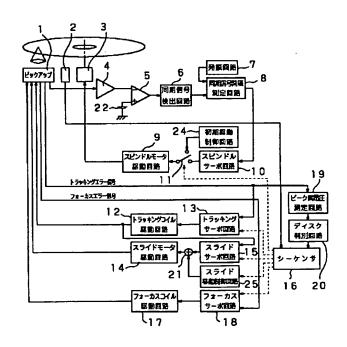
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

### (54) 【発明の名称】 光ディスク再生装置

### (57)【要約】

【目的】 通常密度の光ディスクと高密度光ディスクと を光ピックアップで検出した信号から識別できる。

ピーク間電圧測定回路19は、ピックアップ 1から送られるトラッキングエラー信号から使用する光 ディスクの一回転周期に現れるピーク間の電圧を測定 し、この測定結果をディスク判別回路20に送る。ディ スク判別回路20は、上記光ディスクが通常密度の光デ ィスク、または高密度光ディスクの何れであるか判別 し、この判別結果をシーケンサ16に送る。シーケンサ 16は、上記判別結果に基づいて上記光ディスクが本装 置にて再生可能であれば、サーボ回路系及びスライド移 動制御回路25に上記光ディスクのデータ再生に適応す るような制御信号を送り、再生不可能であればこの光デ ィスクを排出する動作を行う。



光ディスク再生装置の第一の実施例のプロック図

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ディスク上に記録された信号を再生する光ディスク再生装置において、

上記光ディスク上に記録された信号を光学的に読み取る ピックアップと、

上記ピックアップを上記光ディスクの径方向の特定位置 に移動させる移動制御手段と、

上記ピックアップにて上記光ディスク上に記録された信号を読み取る際のフォーカスサーボ制御するフォーカス サーボ制御手段と、

上記ピックアップにて上記光ディスク上に記録された信号を読み取り得られるトラッキングエラー信号の振幅を 測定する振幅測定手段と、

上記トラッキングエラーの振幅測定手段の測定結果から 上記光ディスクを判別する光ディスク判別手段と、

上記光ディスク判別手段の判別結果に応じて、上記移動 制御手段の動作を制御するシーケンサとを有することを 特徴とする光ディスク再生装置。

【請求項2】 上記トラッキングエラーの振幅測定手段は、上記トラッキングエラー信号の上記光ディスクー回 20 転周期に現れるピーク間の電圧を測定することを特徴とする請求項1記載の光ディスク再生装置。

【請求項3】 光ディスク上に記録された信号を再生する光ディスク再生装置において、

上記光ディスク上に記録された信号を光学的に読み取る ピックアップと、

上記ピックアップを上記光ディスクの径方向の特定位置 に移動させる移動制御手段と、

上記ピックアップにて上記光ディスク上に記録された信号を読み取る際のフォーカスサーボ制御するフォーカス 30サーボ制御手段と、

上記ピックアップにて上記光ディスク上に記録された信号を読み取り得られる再生信号の振幅を測定する再生信号振幅測定手段と、

上記再生信号振幅測定手段の測定結果から上記光ディスクを判別する光ディスク判別手段と、

上記光ディスク判別手段の判別結果に応じて、上記移動 制御手段の動作を制御するシーケンサとを有することを 特徴とする光ディスク再生装置。

【請求項4】 上記再生信号振幅測定手段は、上記再生 40 信号の包絡線の上記光ディスクー回転周期に現れるピー ク間の電圧を測定することを特徴とする請求項3記載の 光ディスク再生装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光を光ディスク に照射して該光ディスクに記録されている情報信号を再 生する光ディスク再生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図6は、従来の光ディスク再生装置の概 50 一ポ信号がスピンドルモータ駆動回路72に送られるよ

略構成を示す図である。

【0003】図6で、ピックアップ61から送られる再 生信号は、RF信号アンプ64、コンパレータ65、同 期信号検出回路66、同期信号間隔測定回路68、スピ ンドルサーボ回路70、スピンドルモータ駆動回路72 を介して、スピンドルモータ63にスピンドルモータ駆 動信号として送られる。また、ピックアップ61から送 られるトラッキングエラー信号は、トラッキングサーボ 回路74及びトラッキングコイル駆動回路75を介して 10 ピックアップ61のトラッキングコイルにトラッキング コイル駆動信号として送られる。また、トラッキングコ イル駆動回路75から送られるトラッキングコイル駆動 信号は、スライドサーボ回路76に送られ、スライドモ ータ駆動回路78を介してピックアップ61のスライド モータにスライドモータ駆動信号として送られる。ま た、ピックアップ61から送られるフォーカスエラー信 号は、フォーカスサーボ回路79及びフォーカスコイル 駆動回路80を介してピックアップ61のフォーカスコ イルにフォーカスコイル駆動信号として送られる。

【0004】ここで、図6によれば、光ディスク60の再生起動時に、シーケンサ73は、スライド移動制御回路77に制御信号を送り、スライドモータ駆動回路78を動作させて、その結果ピックアップ61は、最内周検知スイッチ62をオンにするまで光ディスク60の径方向に移動する。最内周検知スイッチ62がオン状態になると、シーケンサ73は切換スイッチ71に初期駆動制御回路69とスピンドルモータ駆動回路72とが接続するように切換制御信号を送り、初期駆動制御回路69から初期駆動信号がスピンドルモータ駆動回路72に送られ、スピンドルモータ駆動信号が発生し、スピンドルモータ63はこのスピンドルモータ駆動信号の入力に応じて回転駆動を開始する。

【0005】次に、ピックアップ61は、光ディスク6 0に、例えば780nmのレーザ光を照射して、反射光 を再生信号として検出する。この再生信号は、RF信号 アンプ64に送られ増幅処理された後、さらにコンパレ ータ65に送られ、二値化される。この二値化された信 号は、8-14変調 (eight to fourteen modulation: 以下、EFMという。)方式にて変調された信号であ り、この信号は、1チャンネルビット当たり588ビッ トのフレーム信号から成り、このフレーム内にフレーム 同期パターンが存在する。このフレーム同期パターンを ク同期信号検出回路66にて検出し、ここで検出した同 期信号が同期信号間隔測定回路68に送られる。同期信 号間隔測定回路68は、OCR67から送られる基準ク ロック信号に基づいて上記同期信号の間隔を測定し、こ の測定結果をスピンドルサーボ回路70に送る。スピン ドルサーボ回路70は、上記同期信号の間隔に基づいて スピンドルサーボ信号を発生し、またこのスピンドルサ

うに、切換スイッチ71がシーケンサ73により切換操 作される。スピンドルモータ駆動回路72に送られたス ピンドルサーボ信号は、スピンドルモータ駆動信号にな り、スピンドルモータ63の動作を制御する。

【0006】また、ピックアップ61は、例えば、レー ザダイオード、コリメータレンズ、対物レンズ、ピーム スプリッタ、シリンドリカルレンズ等の光学部品及びフ ォトディテクタ等から構成され、レーザビームを光ディ スク60の記録面に照射し、この記録面からの反射光の 強度変化を測定すると共に、例えばいわゆる非点収差法 10 により上記フォーカスエラー信号を検出しフォーカスサ ーボ回路79に送り、また例えばいわゆるブッシュブル 法により上記トラッキングエラー信号を検出しトラッキ ングサーボ回路74に送る。

【0007】フォーカスサーボ回路79は、上記フォー カスエラー信号が零となるようにフォーカス駆動回路8 0を通じて、ピックアップ61内の上記対物レンズを光 軸方向に駆動する信号をピックアップ61に送る。

【0008】トラッキングサーボ回路74は、トラッキ ングコイル駆動回路75を通じて、トラッキングエラー 20 を打ち消すように上記対物レンズを光ディスク60の記 録面に沿って駆動する信号をピックアップ61に送る。 また、この信号は、スライドサーボ回路76にも送られ る。スライドサーボ回路76は、ピックアップ61によ る光ディスク60の読み取りが上記記録面のトラックか ら外れないように、光ディスク60の径方向に上記対物 レンズを駆動する信号を、加算回路81、スライドモー タ駆動回路78を通じてピックアップ61に送る。

【0009】また、シーケンサ73は、上述したよう に、スライド移動制御回路77及び切換スイッチ71の 30 動作を制御すると共に、トラッキングサーボ回路74、 スライドサーボ回路76及びフォーカスサーボ回路79 の動作も制御する。

### [0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、現在 使用されている光ディスクよりも高密度で大容量の光デ ィスク(以下、高密度光ディスクという。)が開発され るようになり、この開発の一例として、トラックピッチ を小さくして記録密度を向上させる方法がとられてい る。

【0011】これに伴い、再生機側では、通常密度の光 ディスクと高密度光ディスクとの識別が必要になってき ている。例えば、両光ディスク間で径が異なる場合は、 再生機台上の直径差に光ディスクの有無を検出するセン サを備えることで、両者の区別が可能である。ところ が、高密度光ディスクの形状が通常密度の光ディスクの 形状と同じである場合、機械的に両者の区別を行うのは 不可能であった。

【0012】本発明は、上述した実情に鑑みてなされた ものであり、通常密度の光ディスクと髙密度光ディスク 50 号を光学的に読み取り得られる再生信号の振幅、例えば

とを光ピックアップで検出した信号から識別することが できる光ディスク再生装置の提供を目的とする。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】本発明に係る光ディスク 再生装置は、上述した問題を解決するために、光ディス ク上に記録された信号を光学的に読み取るピックアップ と、上記ピックアップを上記光ディスクの径方向の特定 位置に移動させる移動制御手段と、上記ピックアップに て上記光ディスク上に記録された信号を読み取る際のフ ォーカスサーボ制御するフォーカスサーボ制御手段と、 上記ピックアップにて上記光ディスク上に記録された信 号を読み取り得られるトラッキングエラー信号の振幅を 測定する振幅測定手段と、上記トラッキングエラー信号 の振幅測定手段の測定結果から上記光ディスクを判別す る光ディスク判別手段と、上記光ディスク判別手段の判 別結果に応じて、上記移動制御手段の動作を制御するシ ーケンサとを有している。

【0014】上記トラッキングエラー信号の振幅測定手 段は、上記トラッキングエラー信号の上記光ディスクー 回転周期に現れるピーク間の電圧を測定することが好ま LW.

【0015】また、本発明に係る光ディスク再生装置 は、上述した問題を解決するために、光ディスク上に記 録された信号を光学的に読み取るピックアップと、上記 ピックアップを上記光ディスクの径方向の特定位置に移 動させる移動制御手段と、上記ピックアップにて上記光 ディスク上に記録された信号を読み取る際のフォーカス サーボ制御するフォーカスサーボ制御手段と、上記ピッ クアップにて上記光ディスク上に記録された信号を読み 取り得られる再生信号の振幅を測定する再生信号振幅測 定手段と、上記再生信号振幅測定手段の測定結果から上 記光ディスクを判別する光ディスク判別手段と、上記光 ディスク判別手段の判別結果に応じて、上記移動制御手 段の動作を制御するシーケンサとを有している。

【0016】上記再生信号振幅測定手段は、上記再生信 号の包絡線の上記光ディスクー回転周期に現れるピーク 間の電圧を測定することが好ましい。

# [0017]

【作用】本発明に係る光ディスク再生装置によれば、ピ ックアップにて光ディスク上に記録された信号を光学的 に読み取り得られるトラッキングエラー信号の振幅、例 えば電圧を測定する振幅測定手段にて、上記振幅を検出 し、この検出結果から光ディスク判別手段にて上記光デ ィスクが通常密度の光ディスクであるか、あるいは高密 度光ディスクであるかを判別し、この判別結果に応じ て、シーケンサが上記ピックアップの移動制御手段の動 作を制御する。

【0018】また、本発明に係る光ディスク再生装置に よれば、ピックアップにて光ディスク上に記録された信

電圧を測定する再生信号振幅測定手段にて、上記振幅を 検出し、この検出結果から光ディスク判別手段にて上記 光ディスクが通常密度の光ディスクであるか、あるいは 高密度光ディスクであるかを判別し、この判別結果に応 じて、シーケンサが上記ピックアップの移動制御手段の 動作を制御する。

#### [0019]

【実施例】以下、本発明に係る光ディスク再生装置が適 用される好ましい実施例について、図面を参照しながら 詳細に説明する。

【0020】図1は、本発明に係る光ディスク再生装置 の第一の実施例の概略構成を示すブロック回路図であ る。

【0021】図1で、ピックアップ1は、光ディスク上 に記録された信号を光学的に読み取って得られる後述す るフォーカスサーボ制御されたトラッキングエラー信号 を、ピーク間電圧測定回路19に送っている。また、ピ ックアップ1の上記光ディスクの径方向の特定位置への 移動は、スライド移動制御回路25にて制御される。ま た、フォーカスサーボ回路18は、ピックアップ1にて 20 上記光ディスク上に記録された信号を読み取る際のフォ ーカスサーボ制御している。また、ピーク間電圧測定回 路19は、上記トラッキングエラー信号の振幅をピーク 電圧として測定して、この振幅測定結果をディスク判別 回路20に送っている。ディスク判別回路20は、上記 トラッキングエラー信号の振幅が後述する光学系のレス ポンス関数 (modulation transfer function:以下、M TFという。)と空間周波数との関係に基づいて、後述 するトラック密度の高低に応じて上記振幅が変化する点 に着目して、挿入された記録密度の異なる光ディスクを 30 識別して、この識別結果をシーケンサ16に送ってい る。シーケンサ16は上記識別結果に基づいて、スライ・ ド移動制御回路25の動作を制御している。

【0022】以下、各構成の動作説明を行う。図1にお いて、ピックアップ1は、例えばレーザダイオード、コ リメータレンズ、対物レンズ、ピームスプリッタ、シリ ンドリカルレンズ等の光学部品及びフォトディテクタ等 から構成され、本実施例の光ディスク再生装置(以下、 本実施例の装置という。)が電源オン状態になると、後 述するスライドモータ駆動回路9から送られるスライド 40 モータ駆動信号に基づいて特定位置検知スイッチ2に接 触するまで、光ディスクの径方向に移動する。さらに、 上記レーザダイオードにて発生させるレーザビームを光 ディスク上の記録面に照射し、反射光を記録信号として 読み取って得られるRF信号を増幅演算回路4に送り、 上記記録信号を読み取り得られるトラッキングエラー信 号をトラッキングサーボ回路13及びピーク間電圧測定 回路19へ送り、また、上記記録信号を読み取り得られ るフォーカスエラー信号をフォーカスサーボ回路18に 送る。また、後述するトラッキングコイル駆動回路12 50

から送られるトラッキングコイル駆動信号、スライドモ ータ駆動回路14から送られるスライドモータ駆動信号 及びフォーカスコイル駆動回路17から送られるフォー カスコイル駆動信号に基づいて、上記記録信号を読み取 る際のトラック動作が制御される。

【0023】また、ピーク間電圧測定回路19は、ピッ クアップ1より送られる上記トラッキングエラー信号 で、特にトラッキングサーボ回路をオンにする前の、い わゆる光ディスクの偏心のみに依存する光ディスク一回 転周期のトラッキングエラー信号のピーク間の電圧の差 10 異を検出し、この検出結果から振幅値、すなわちMTF を求めて、このMTFから空間周波数、すなわち挿入さ れた光ディスクのトラックピッチ間隔を検出し、この検 出されたトラックピッチの間隔の値をディスク判別回路 20に送る。

【0024】ここで、図2は、上述した本実施例の光デ ィスク再生装置の動作原理の説明図として挙げる、初期 動作時にピーク間電圧測定回路19にて得られるトラッ キングエラー信号の波形を示す。

【0025】図2において、ここで示される信号波形 は、後述するように、トラッキングサーボ回路13及び スライドサーボ回路15がオフの状態、すなわちフォー カスサーボ回路18のみがオンになった状態で得られる トラッキングエラー信号である。光ディスクを本実施例 の装置に挿入し、後述する初期動作を行うと上記光ディ スクが回転し、この光ディスクの中心とスピンドルモー タ3の回転軸とのずれ、いわゆる偏心が生じるため、ピ ックアップ1から上記光ディスクの記録面に照射させる レーザ光が上記ディスク上の記録面のトラックを横切る ことになるので、上記トラッキングエラー信号はスピン ドルモータ3の回転に同期した波形を示している。矢印 31で示される範囲は、スピンドルモータ3の回転の一 回転に相当する周期であり、矢印32に示される範囲 は、以下に説明する光学系のレスポンス関数の絶対値 (modulation transfer function:以下、MTFとい う。) に相当する振幅値、すなわちトラッキングエラー 信号の電圧を指している。

【0026】図3は、MTFと空間周波数との関係を示 す図である。

【0027】図3によれば、空間周波数(f)が増加す ると、MTF(A)は減少することが示されている。こ こで、光ディスク上のトラックピッチを増加させるとト ラックピッチ間隔は小さくなり、空間周波数は増加す る。従って、空間周波数(f)の値は、光ディスク上の トラックピッチの数に対応することが言える。ここで、 例えば、高密度光ディスク上のトラックピッチ数に対応 する空間周波数を f<sub>i</sub>、また、通常密度の光ディスクの トラックピッチ数に対応する空間周波数をf, として、 空間周波数 f, に対するMTFをA, 、空間周波数 f, に対するMTF をA,とすると、f,> f,であるの

で、A、〈A、となる。従って、上記トラッキングエラー信号の振幅においては、通常密度の光ディスクの振幅の方が大きくなる。また、上記トラッキングエラー信号の振幅より得られるMTFから対応する空間周波数、すなわちトラックピッチの間隔の値を得ることが可能である。

【0028】ディスク判別回路20は、ピーク間電圧測定回路19から送られる挿入された光ディスクのトラックピッチの間隔の値に基づいて、上記光ディスクが通常密度の光ディスクであるか、あるいは高密度光ディスク 10であるかを判別し、この判別結果をシーケンサ16に送る。

【0029】シーケンサ16は、本実施例の装置が電源 オン状態で、光ディスクを挿入する前は、切換スイッチ 11にスピンドルモータ駆動回路9とスピンドルサーボ 回路10とが接続するように切換制御信号を送ると共 に、全てのサーボ回路系及びスライド移動制御回路25 に動作オフの制御信号を送る。また、上記初期動作、す なわち光ディスクを本実施例の装置に挿入する動作を行 うと、シーケンサ16は、切換スイッチ11にスピンド 20 ルモータ駆動回路9と初期駆動制御回路24とが接続す るように切換制御信号を送ると同時に、フォーカスサー ボ回路18及びスライド移動制御回路25に動作オンの 制御信号を送る。この状態において、特定位置検知スイ ッチ2より上記検知信号が送られる前では、シーケンサ 16は、さらにトラッキングサーボ回路13及びスライ ドサーボ回路15に動作オフの制御信号を送る。また、 上記検知信号が送られて再生状態になる前では、シーケ ンサ16は、切換スイッチ11にスピンドルモータ駆動 回路9とスピンドルサーボ回路10とが接続するように 30 切換制御信号を送ると共に、スライド移動制御回路25 に動作オフの制御信号を送る。また、この状態にてディ スク判別回路20から上記判別結果が送られると、この 判別結果に応じて、上記光ディスクが本実施例の装置で 再生可能なものであれば再生コマンド待機状態になり、 また、上記光ディスクが再生不可能なものであれば全て のサーボ回路系及びスライド移動制御回路25に動作オ フの信号を送り、本実施例の装置の動作を停止させ、上 記光ディスクをイジェクトする。また、上記再生コマン ド待機状態である場合、再生コマンドが入力されると全 40 てのサーボ回路系及びスライド移動制御回路25に動作 オンに制御信号を送り、本実施例の装置を上記RF信号 からデータの再生を行うのに適応した光ディスク再生処 理回路に切り換える。

【0030】また、トラッキングサーボ回路13は、ピックアップ1から送られる上記トラッキングエラー信号をトラッキングコイル駆動回路12に送ることにより、上記対物レンズをトラッキング制御している。また、トラッキングサーボ信号をトラッキングコイル駆動回路12に送っている。なお、トラッキングサーボ回路13の50

動作のオン/オフ制御は、シーケンサ16から送られる上記動作オン/オフの制御信号の中のトラッキングサーボ回路制御信号に基づいて行われる。続いて、トラッキングコイル駆動回路12は、トラッキングサーボ回路13から上記トラッキングサーボ信号に基づいて、トラッキングコイル駆動信号を発生し、このトラッキングコイル駆動信号をピックアップ1のアクチュエータ内のトラッキングコイル及びスライドサーボ回路15に送る。

【0031】スライドサーボ回路15は、上記トラッキ ングコイル駆動信号に基づいて行うピックアップ1のト ラック動作が、光ディスクの記録面のトラックから外れ ないようにするための、ピックアップ1の光ディスクの 径方向への移動を制御するスライドサーボ信号を発生 し、このスライドサーボ信号を加算回路21に送る。ま た、スライドサーボ回路15の動作のオン/オフ制御 は、シーケンサ16から送られる上記動作オン/オフの 制御信号の中のスライドサーボ回路制御信号に基づいて 行われる。また、スライド移動制御回路25は、シーケ ンサ16から送られる制御信号に応じてピックアップ1 の光ディスクの径方向の移動を制御する信号を発生させ る。すなわち、シーケンサ16より動作オンの制御信号 が入力されているときはピックアップ1を上記光ディス クの径方向に移動させるスライド移動制御信号を、ま た、動作オフの制御信号が入力されているときはピック アップ1の径方向の移動を停止するスライド移動制御信 号を発生し、加算回路21に送る。

【0032】加算回路21は、スライドサーボ回路15から送られる上記スライドサーボ信号と、スライド移動制御回路25から送られるスライド移動制御信号とを加算処理して、この加算処理後のスライドサーボ信号をスライドモータ駆動回路14は、加算回路21から送られる上記加算処理後のスライドサーボ信号に基づいて、ピックアップ1を上記光ディスクの径方向に移動させるスライドモータ駆動信号を発生させ、このスライドモータ駆動信号をピックアップ1のスライドモータに送る。

【0033】また、フォーカスサーボ回路18は、ピックアップ1から送られる上記フォーカスエラー信号に基づいて、フォーカスエラー成分を打ち消すように上記対物レンズをフォーカシング制御している。また、フォーカスサーボ信号をフォーカスコイル駆動回路17に送る。なお、フォーカスサーボ回路18の動作のオン/オフの制御信号の中のフォーカスサーボ回路制御信号に基づいて行われる。フォーカスコイル駆動回路17は、フォーカスサーボ回路18から送られる上記フォーカスサーボ信号に基づいて、ピックアップ1内の上記対物レンズの上記フォーカシング駆動を行わせるためのフォーカスコイル駆動信号を発生し、このフォーカスコイル駆動信号をピックアップ1のフォーカスコイルに送る。

【0034】また、増幅演算回路4は、ピックアップ1から送られる上記RF信号を増幅演算処理し、演算処理後のRF信号をコンパレータ5の被比較入力端子に送られる比較電 正用電源22からの比較基準電圧と、被比較入力端子に送られる上記演算処理後のRF信号とを比較して、この比較結果を二値化信号にして、同期信号検出回路6に送る。なお、上記二値化信号は、8-14変調(eight to fourteen modulation:以下、EFMという。)方式にて変調された信号である。

【0035】同期信号検出回路6は、コンパレータ5より送られる上記二値化信号がEFM方式にて変調された信号であるため、1チャンネル当たり588ピットから成るフレーム信号中に、フレーム同期パターンが存在することに着目し、このフレーム同期パターンを上記二値化信号から検出して、同期信号間隔測定回路8に送る。また、発振回路7は、標準クロック信号を発生し、この標準クロック信号を同期信号間隔測定回路8に送る。標準クロック信号を同期信号間隔測定回路8に送る。

【0036】同期信号間隔測定回路8は、上記フレーム同期パターンと上記標準クロック信号とから、上記RF信号中の同期信号の間隔を測定し、この測定結果をスピンドルサーボ回路10に送る。

【0037】スピンドルサーボ回路10は、同期信号間隔測定回路8から送られる測定結果に基づいて、上記同期信号の間隔に基づいてスピンドルサーボ信号を発生し、このスピンドルサーボ信号を切換スイッチ11を介して、スピンドルモータ駆動回路9に送る。また、初期駆動制御回路24は、本実施例の装置が電源オン状態の間、特に上記初期動作を行わせる際にスピンドルモータ3を駆動するための初期駆動制御信号を発生し、この初30期駆動制御信号を切換スイッチ11を介してスピンドルモータ駆動回路9に送る。

【0038】ここで、切換スイッチ11は、シーケンサ16から送られる上記切換制御信号に基づいて、スピンドルモータ駆動回路9に送る信号を、初期駆動制御回路24から送られる上記初期駆動制御信号、あるいはスピンドルサーボ回路10から送られる上記スピンドルサーボ信号の何れかに切り換える動作をする。すなわち、切換スイッチ11は、後述する特定位置検知スイッチ2がオン状態になった直後で、本実施例の装置が挿入された40光ディスクを再生する状態でない場合は、初期駆動制御回路24から送られる初期駆動制御信号をスピンドルモータ駆動回路9に送り、また、本実施例の装置が上記光ディスクを再生する状態である場合は、スピンドルサーボ回路10から送られるスピンドルサーボ信号をスピンドルモータ駆動回路9に送るように切換動作を行う。

【0039】スピンドルモータ駆動回路9は、初期駆動 制御回路24から送られる上記初期駆動制御信号、また は、スピンドルサーボ回路10から送られる上記スピン ドルサーボ信号に基づいて、スピンドルモータ3を回転 50

するためのスピンドルモータ駆動信号を発生し、このスピンドルモータ駆動信号をスピンドルモータ3に送る。スピンドルモータ3は、スピンドルモータ駆動回路9から送られる上記スピンドルモータ駆動信号に基づいて回転駆動し、上記光ディスクを回転させる。

【0040】また、特定位置検知スイッチ2は、上記光ディスク上の記録面に記録信号が確実に存在する位置上に配置される。また、本実施例の装置が動作オンになり、ピックアップ1が上記初期動作状態に入り、上記ス10 ライドモータ駆動信号に基づいて上記光ディスクの径方向に移動する際に、特定位置検知スイッチ2は、ピックアップ1と接触してオン状態になると、検知信号をシーケンサ16に送る。

【0041】図4は、本発明に係る光ディスク再生装置の第二の実施例の概略構成を示すブロック回路図である。

【0042】図4で、ピックアップ41は、光ディスク 上に記録された信号を光学的に読み取って得られる後述 するフォーカスサーボ制御された再生(RF)信号を、 ピーク間電圧測定回路26に送っている。また、ピック アップ41の上記光ディスクの径方向の特定位置への移 動は、スライド移動制御回路25にて制御される。ま た、フォーカスサーボ回路18は、ピックアップ1にて 上記光ディスク上に記録された信号を読み取る際のフォ ーカスサーボ制御している。また、ピーク間電圧測定回 路26は、上記RF信号の振幅をピーク電圧として測定 して、この振幅測定結果をディスク判別回路27に送っ ている。ディスク判別回路27は、上記RF信号の振幅 が後述する光学系のレスポンス関数 (modulation trans fer function:以下、MTFという。)と空間周波数と の関係に基づいて、後述するトラック密度の高低に応じ て上記振幅が変化する点に着目して、挿入された記録密 度の異なる光ディスクを識別して、この識別結果をシー ケンサ16に送っている。シーケンサ16は上記識別結 果に基づいて、スライド移動制御回路25の動作を制御 している。

【0043】以下、各構成の動作説明を行うが、図4で示される構成で、図1と同じ番号が付されたものは、図1を用いて説明した動作と同様の動作を行うものであるため、ここでは、図1と異なる番号を付した構成及び図1で付した番号とは同じだが動作が異なる構成の説明のみを行う。ここで、図4において、ピックアップ41は図1で示したピックアップ1と同様の構成であり、本実施例の光ディスク再生装置(以下、本実施例の装置という。)が電源オン状態になると、第一の実施例でも述べたように、スライドモータ駆動回路9から送られるスライドモータ駆動信号に基づいて特定位置検知スイッライドモータ駆動信号に基づいて特定位置検知スイッライドモータ駆動信号に基づいて特定位置検知スイッライドモータ取動信号に基づいて特定位置検知スイッライドモータ取動信号に基づいて特定位置を知るように、ピックアップ41内のレーザダイオードにて発生させるレーザビームを光ディスク上の記録面に照射し、反

. 11

射光を記録信号として読み取って得られるRF信号を増幅演算回路44に送り、上記記録信号を読み取り得られるトラッキングエラー信号をトラッキングサーボ回路13に送り、また、上記記録信号を読み取り得られるフォーカスエラー信号をフォーカスサーボ回路18に送る。また、第一の実施例でも述べたように、トラッキングコイル駆動回路12から送られるトラッキングコイル駆動信号、スライドモータ駆動回路14から送られるスライドモータ駆動信号及びフォーカスコイル駆動回路17から送られるフォーカスコイル駆動信号に基づいて、上記10記録信号を読み取る際のトラック動作が制御される。

【0044】また、増幅演算回路44は、ピックアップ41から送られる上記RF信号を増幅演算処理し、演算処理後のRF信号をコンパレータ5の被比較入力端子及びピーク間電圧測定回路26に送る。

【0045】また、ピーク間電圧測定回路26は、第一の実施例で述べたトラッキングエラー信号の場合と同様に、ピックアップ41より送られるRF信号で、特にトラッキングサーボ回路をオンにする前の、いわゆる光ディスクの偏心のみに依存する光ディスク一回転周期のR 20 F信号の包絡線のピーク間の電圧の差異を検出し、この検出結果から振幅値、すなわちMTFを求めて、このMTFから空間周波数、すなわち挿入された光ディスクのトラックピッチ間隔を検出し、この検出されたトラックピッチ間隔の値をディスク判別回路27に送る。

【0046】ここで、図5は、上述した本実施例の光ディスク再生装置の動作原理の説明図として挙げる、初期動作時にピーク間電圧測定回路26にて得られるRF信号の波形を示す。

【0047】図5において、ここで示される信号波形 は、第一の実施例でも説明したトラッキングエラー信号 の場合と同様に、トラッキングサーボ回路13及びスラ イドサーボ回路15がオフの状態、すなわちフォーカス。 サーボ回路18のみがオンになった状態で得られるRF 信号である。光ディスクを本実施例の装置に挿入し、後 述する初期動作を行うと上記光ディスクが回転し、この 光ディスクの中心とスピンドルモータ3の回転軸とのず れ、いわゆる偏心が生じるため、ピックアップ1から上 記光ディスクの記録面に照射させるレーザ光が上記ディ スク上の記録面のトラックを横切ることになるので、上 40 記RF信号はスピンドルモータ3の回転に同期した波形 を示している。矢印51で示される範囲は、スピンドル モータ3の回転の一回転に相当する周期であり、矢印5 2に示される範囲は、図3を用いて説明した上記光学系 のレスポンス関数の絶対値(MTF)に相当する振幅 値、すなわちRF信号の電圧を指している。ここで、R F信号の振幅においても、第一の実施例で説明したトラ ッキングエラー信号の振幅と同様に、通常密度の光ディ スクの振幅の方が大きくなる。また、上記RF信号の振 幅より得られるMTFから対応する空間周波数、すなわ 50

ち光ディスクのトラックピッチの間隔の値を得ることが 可能である。このトラックピッチの間隔の値がディスク 判別回路27に送られる。

【0048】ディスク判別回路27は、ピーク間電圧測定回路26から送られる上記トラックピッチの間隔の値に基づいて、上記光ディスクが通常密度の光ディスクであるか、あるいは高密度光ディスクであるかを判別し、この判別結果をシーケンサ16に送る。

【0049】以上のように構成することで、ユーザは、 光ディスクを光ディスク再生装置にセットし動作を開始 することで、上記光ディスクが通常密度の光ディスク、 あるいは高密度光ディスクの何れであるか知ることがで きる。

【0050】なお、第一及び第二の実施例では、光ディスクのトラックピッチ間隔を検出するのに、トラッキングエラー信号、あるいはRF信号の出力信号の上記光ディスクー回転周期に現れるピーク間の電圧の振幅値を用いたが、これに限定されることはなく、例えば、上記出力信号を検波整流後、平滑フィルタにて処理した後、得られる信号波形の振幅値を用いる等、上記光ディスクのトラックピッチ間隔を検出することができれば、他の方法を用いてもよいことは言うまでもない。

【0051】また、第一及び第二の実施例では、挿入された光ディスクが再生不可能である場合、この光ディスクをイジェクトする動作を行うことを挙げたが、これに限定されることはなく、例えば、表示画面を設けてこの表示画面上にエラー表示を行うといった動作を行わせてもよい。また、それぞれの記録密度を有する光ディスクを再生可能な機能を有する複数の光ディスク再生部分を設けて、識別した光ディスクに応じた光ディスク再生部分を自動的に切り換える光ディスク再生装置としても、本発明の効果が得られることは言うまでもない。

# [0052]

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明に係る 光ディスク再生装置によれば、ピックアップにて光ディ スク上に記録された信号を光学的に読み取る際発生する トラッキングエラー信号の電圧を測定するトラッキング 電圧測定手段にて上記電圧の振幅を検出し、この検出結 果から光ディスク判別手段にて上記光ディスクが通常密 度の光ディスクであるか、あるいは高密度光ディスクで あるかを判別するので、使用者は、使用する光ディスク を上記光ディスク再生装置に挿入するだけで、この光ディスクが通常密度の光ディスクであるか、あるいは高密 度光ディスクであるかを識別することができる。

【0053】また、本発明に係る光ディスク再生装置によれば、ピックアップにて光ディスク上に記録された信号を読み取り得られる再生信号の電圧を測定する電圧測定手段にて上記電圧の振幅を測定し、この検出結果から光ディスク判別手段にて上記光ディスクが通常密度の光ディスクであるか、あるいは高密度光ディスクであるか

を判別するので、使用者は、使用する光ディスクを上記 光ディスク再生装置に挿入するだけで、この光ディスク が通常密度の光ディスクであるか、あるいは高密度光ディスクであるかを識別することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光ディスク再生装置の第一の実施 例の概略構成を示すブロック回路図である。

【図2】第一の実施例の光ディスク再生装置の動作原理 を説明する図である。

【図3】MTFと空間周波数との関係を示す図である。

【図4】本発明に係る光ディスク再生装置の第二の実施 例の概略構成を示すプロック回路図である。

【図5】第二の実施例の光ディスク再生装置の動作原理 を説明する図である。

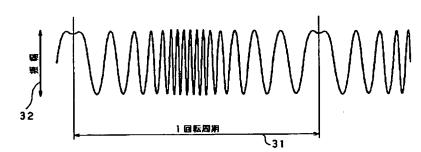
【図6】従来の光ディスク再生装置の概略構成を示すブロック回路図である。

# 【符号の説明】

- 1 ピックアップ
- 2 特定位置検知スイッチ
- 3 スピンドルモータ
- 4 增幅演算回路
- 5 コンパレータ
- 6 同期信号検出回路

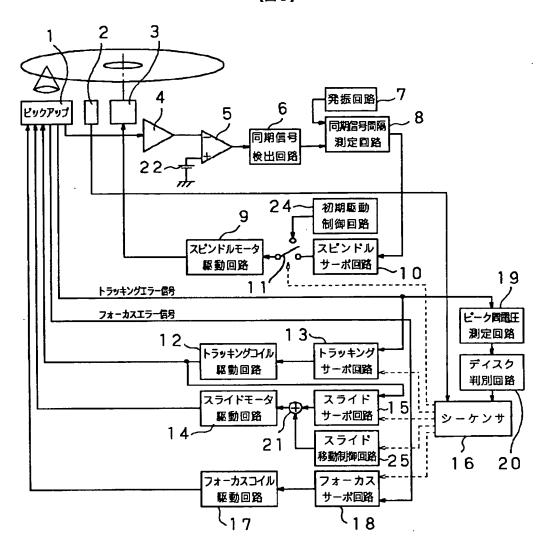
- 7 発振回路
- 8 同期信号間隔測定回路
- 9 スピンドルモータ駆動回路
- 10 スピンドルサーボ回路
- 11 切換スイッチ
- 12 トラッキングコイル駆動回路
- 13 トラッキングサーボ回路
- 14 スライドモータ駆動回路
- 15 スライドサーボ回路
- 10 16 シーケンサ
  - 17 フォーカスコイル駆動回路
  - 18 フォーカスサーボ回路
  - 19 ピーク間電圧測定回路
  - 20 ディスク判別回路
  - 21 加算回路
  - 22 比較電圧用電源
  - 24 初期駆動制御回路
  - 25 スライド移動制御回路
  - 26 ピーク間電圧測定回路
- 20 27 ディスク判別回路
  - 41 ピックアップ
  - 44 增幅演算回路

【図2】



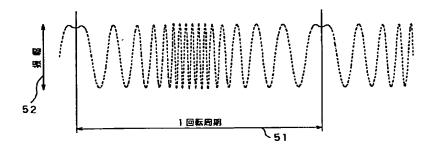
本実施例の光ディスク再生装置の動作原理の説明図

【図1】



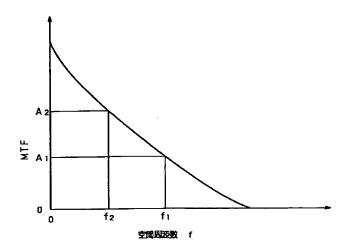
光ディスク再生装置の第一の実施例のプロック図

【図5】



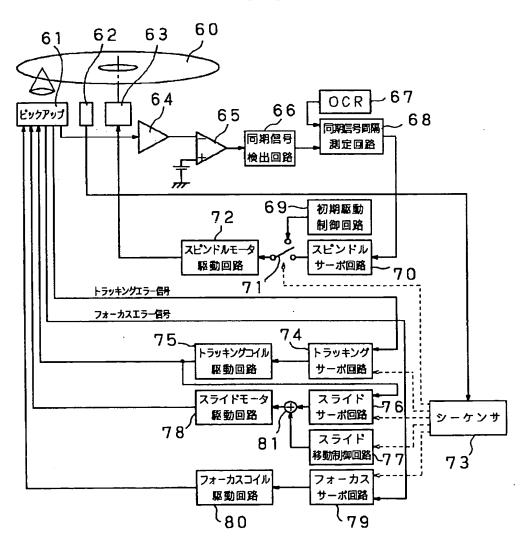
本夷族例の光ディスク再生装置の創作原理の説明図

[図3]

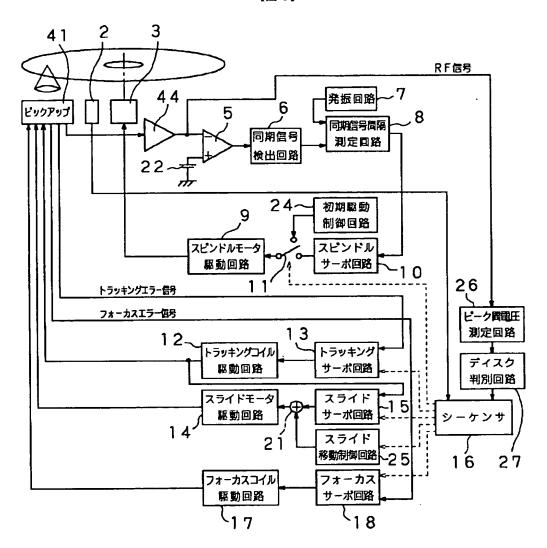


MTFと空間周波数との関係図

【図6】



[図4]



光ディスク再生装置の第二の実施例のプロック図

# Citation

# 1'

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-083465

(43)Date of publication of application: 26.03.1996

(51)Int.CI.

G11B 19/12 G11B 7/09

(21)Application number: 06-218541

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

13.09.1994 (72)Invento

(72)Inventor: TSUTSUI KEIICHI

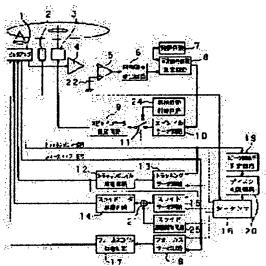
**IGARASHI KATSUJI** 

# (54) OPTICAL DISK REPRODUCING DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To discriminate between an optical disk of normal density and an optical disk of high density by a signal detected by an optical pickup.

CONSTITUTION: A peak-to-peak-voltage measuring circuit 19 measures peak-to-to- peak-voltage appearing every one rotation period of an optical disk which is obtained from a tracking error signal sent from a pickup 1, and sends this measured result to a disk discriminating circuit 20. The disk discriminating circuit 20 discriminates whether the optical disk is an optical disk of normal density of an optical disk of high density, and sends this discriminated result to a sequencer 16. When the optical disk can be reproduced in this device, the sequencer 16 sends a control signal adapting to data reproduction of the optical disk to a servo circuit system and a slide movement control circuit 25, when reproduction cannot be performed, the sequencer 16 eliminates this optical disk.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office